

## **Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноиндустрии. 2-ая школа.**

### [Программа школы](#)

#### **Л1. О реализации методической составляющей Федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы»**

Золотаревский Юрий Михайлович (д.т.н., профессор, зам. директора по научной работе, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений», Москва)

### [Презентация](#)

#### **Л2. Метрологическое обеспечение наноиндустрии**

Лукашов Юрий Евгеньевич (начальник отдела научно-методических основ промышленной метрологии, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы», Москва)

### [Презентация](#)

#### **Л3. Разработка, испытания и применение стандартных образцов**

Добровинский Игорь Евсеевич (ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии», Екатеринбург)

### [Презентация](#)

#### **Л4. Проверка квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний**

Пономарева Ольга Борисовна (ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии», Екатеринбург)

### [Презентация](#)

#### **Л5. Оценивание метрологических характеристик методики и назначение нормативов контроля. Аттестация методик выполнения измерений**

Пикула Нина Павловна (к.х.н., доцент, Томский политехнический университет, Томск)

### [Презентация](#)

#### **Л6. Нанотехнологии. Нанометрология и стандартизация**

Тодуа Павел Андреевич (профессор, генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума», Москва)

[Презентация](#)

#### **Л7. Структура нанокомпозитов 1d кристалл@ОСНТ**

Киселев Николай Андреевич (чл.-корр. РАН, д.б.н., председатель Научного совета РАН по электронной микроскопии, зав. отделом электронной кристаллографии, Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, Москва)

[Презентация](#)

#### **Л8. Создание элементов наноэлектроники с использованием нанокомпозита ОСНТ@пироуглеродное покрытие на приборе Quanta 200 3D**

Артемов Владимир Викторович (к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории электронной микроскопии, Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, Москва)

[Презентация](#)

#### **Л9. Электронная микроскопия материалов наноэлектроники и наносенсоров**

Васильев Александр Леонидович (руководитель Агентства по нанотехнологиям и наноматериалам РНЦ «Курчатовский институт», Москва)

[Презентация](#)

#### **Л10. Отражательная электронная микроскопия для прецизионных измерений поверхности**

Латышев Александр Васильевич (чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе, Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск)

[Презентация](#)

#### **Л11. Основные направления динамического трехмерного анализа наноструктур**

Шкловер Владимир Яковлевич (директор ООО “Системы для микроскопии и анализа”, Москва)

[Презентация](#)

#### **Л12. Измерения электрических и оптических параметров полупроводников в областях с нанометровыми размерами**

Якимов Евгений Борисович (д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией локальной диагностики полупроводниковых материалов, Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка)

[Презентация](#)

**Л13. Развитие методов просвечивающей и растровой электронной микроскопии для аттестации и исследования наноматериалов. Современные типы микроскопов**

Пушин Владимир Григорьевич (д.ф.-м.н., профессор., зав. лабораторией, Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург)

[Презентация](#)

**Л14. Дифракция электронов в измерении характеристик наноматериалов**

Авилов Анатолий Сергеевич (д.ф.-м.н., зав. сектором электронной дифрактометрии, Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, Москва)

[Презентация](#)

**Л15. Диагностика наноструктур на поверхности кремния с помощью сканирующей туннельной микроскопии**

Саранин Александр Александрович (чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток)

[Презентация](#)

**Л16. Количественная характеристика наноструктур методами сканирующей зондовой микроскопии**

Бухараев Анастас Ахметович (д.ф.-м.н., с.н.с., зав. лабораторией физики и химии поверхности, Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН, Казань)

**Л17. Повышение достоверности изображений наноразмерных объектов различного типа в атомно-силовой микроскопии.**

Толстихина Алла Леонидовна (к.ф.-м.н., с.н.с., зав. сектором сканирующей зондовой микроскопии, Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, Москва)

[Презентация](#)

**Л18. Магнитно-силовая микроскопия ферромагнитных наноструктур**

Миронов Виктор Леонидович (к.ф.-м.н., с.н.с., Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород)

[Презентация](#)

**Л19. Использование рентгеновского микрозонда для анализа микро- и нанообъектов**

Ерко Алексей Иванович (д.ф.-м.н., профессор, зам. руководителя отдела «Оптические системы», Берлинский научный центр им. Гельмгольца «Материалы и энергия», BESSY II, Берлин, Германия)

[Презентация](#)

**Л20. Исследование структуры наносистем методом малоуглового рентгеновского и нейтронного рассеяния**

Волков Владимир Владимирович (к.х.н., зав. лабораторией малоуглового рентгеновского рассеивания, Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, Москва)

[Презентация](#)

**Л21. Методы рентгеновской дифракции для анализа наноразмерных материалов**

Антипов Евгений Викторович (д.х.н., профессор, зав. лабораторией неорганической кристаллохимии, Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

[Презентация](#)

**Л22. Структурная характеристика и метрология многослойных наноразмерных гетероструктур**

Пашаев Эльхан Мехралиевич (к.ф.-м.н., с.н.с., ученый секретарь Курчатовского центра синхротронного излучения и нанотехнологий, РНЦ "Курчатовский институт", Москва)

[Презентация](#)

**Л23. Бозе-Эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках в квантовых ямах**

Тимофеев Владислав Борисович (академик РАН, г.н.с., Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка)

[Презентация](#)

**Л24. Влияние размерных эффектов и поверхностей раздела на свойства наноматериалов**

Андриевский Ростислав Александрович (д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт проблем химической физики, Черноголовка)

[Презентация](#)

**Л25. Нанокристаллизация аморфных сплавов на основе алюминия. Структура, свойства, применения**

Бахтеева Наталья Дмитриевна (д.т.н., профессор, в.н.с., Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва)

[Презентация](#)

**Л26. Бентонитовые и палыгорскитовые глины как естественные наноматериалы (кристаллохимическая характеристика, свойства, генезис).**

Наседкин Василий Викторович (профессор, г.н.с., Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва)

[Презентация](#)

**Л27. Характеризация нанокристаллов в сплавах на основе Fe, Ni, Al методами электронной микроскопии и рентгенографии**

Аронин Александр Семенович (д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией структурных исследований, Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка)

[Презентация](#)

**Л28. Адсорбционные и корреляционные методы анализа**

Мельгунов Максим Сергеевич (к.х.н, зав. лабораторией исследования структуры катализаторов, Институт катализа СО РАН, Новосибирск)

[Презентация](#)

**Л29. Методы нанолитографии**

Зайцев Сергей Иванович (д.ф.-м.н., зав. лабораторией теоретической физики, Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка)

[Презентация](#)

**Л30. Рамановская спектроскопия. Исследование наноструктур и наночастиц методами РС**

Тартаковский Илья Иосифович (д.ф.-м.н., в.н.с., Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка)

[Презентация](#)

**Л31. Метрологические проблемы комплексного исследования наноструктур микрообъектов методами когерентной оптической микроскопии**

Индукаев Константин Васильевич (директор по науке, ООО «Лаборатории АМФОРА», Москва)

[Презентация](#)